## 水素雰囲気異方性熱エッチング(HEATE)法による(010)面 β-Ga2O3基板上の幅 7nm 超薄膜高アスペクトナノウォールアレイ

High-aspect ultra-thin Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanowall structures with 7nm-width fabricated by Hydrogen environment anisotropic thermal etching of (010) β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

上智大・理工<sup>1</sup>, 上智大フォトニクスリサーチセンター<sup>2</sup> °大江 優輝<sup>1</sup>,川崎 祐生<sup>1</sup>,伊藤 大智,森谷 祐太<sup>1</sup>,阿部 洗希<sup>1</sup>,木下 堅太郎<sup>1</sup>,富樫 理恵<sup>1</sup>,菊池 昭彦<sup>1,2</sup> Sophia Univ.<sup>1</sup>, Sophia Photonics Research Center,<sup>2</sup> °Yuki Ooe<sup>1</sup>,Yusei Kawasaki<sup>1</sup>,Daichi Ito<sup>1</sup>,Yuta Moriya<sup>1</sup>,Rie Togashi<sup>1</sup>,Akihiko Kikuchi<sup>1,2</sup>

## E-mail: kikuchi@sophia.ac.jp

**はじめに**:酸化ガリウム(Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)は、4.5eVの大きなバンドギャップと良好な電気特性を有し、パワーデバイスを中心としたさまざまな応用が期待されている。<sup>[1]</sup>近年ではGa<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を用いた縦型トランジスタ<sup>[2]</sup>等が報告されており、デバイス応用の多様性と性能向上に向け低損傷で高アスペクト構造を形成できるエッチング技術が重要になっている。我々は、減圧水素雰囲気中での熱分解反応を利用した水素雰囲気異方性熱エッチング(HEATE)法を提案し、β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のエッチング特性について報告した。<sup>[3]</sup>本報告ではエッチング速度の最も遅い(100)面を用いた HEATE 法による、β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の高アスペクトナノウォールアレイの作製を行ったので報告する。

実験: Sn をドープした(010)面β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>単結晶ウェハ表面に、原子層堆積法で厚さ10nmの SiO<sub>2</sub> 膜を成 膜し、電子ビームリソグラフィにより(100)面に沿ったナノウォールマスクを形成後、CF4/O<sub>2</sub>混合ガスによるド ライエッチングで SiO<sub>2</sub> ナノマスクアレイを形成した。この試料を石英管状炉内で水素圧力 100Pa、温度 800℃ の条件で100分間加熱して HEATE による Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の選択エッチングを行った。作製したナノウォー ルアレイの、試料表面を電界放射型走査電子顕微鏡 (SEM)で評価を行った。

**結果**: Fig.1 に水素圧力 100Pa、温度 800℃、60min の条件下でのエッチング速度の面方位依存性を 示す。代表的なエッチング速度は、(010),{101},{101},{100}の順に早く、それぞれ 11.0、2.0、 ~0.3、~0.1 nm/min と見積もられた。Fig.2 に底面である(010)面を 60min エッチング後の表面状 態の SEM 像を示す。60min のエッチングではランダムに分布する菱形ピットと[001]方向に沿った筋 状構造が見られ、筋状構造の最大高さは約 13nm であった。ピットは基板の欠陥に由来していると考えら れ、高品質基板を用いることで低減が期待される。Fig.3 に{100}面で構成されたナノウォールの SEM 像を示す。周期 300nm、高さ約 1.2µm、幅約 7nm、アスペクト比 171 の均一な高アスペ クト超薄膜ナノウォールアレイの作製に成功した。

<u>まとめ</u>: SiO<sub>2</sub>マスクと減圧水素中雰囲気下におけるGa<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の熱分解を利用するHEATE法により、(010)β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>結晶のエッチング特性を調査し、高アスペクトマイクロ/ナノ構造を形成可能であることを検証した。 <u>謝辞</u>:本研究の一部は、JST CREST JPMJCR18T4, JSPS 科研費 JP16K14260 および JP17H02747、上 智大学 2018 年度理工学部申請型研究費(応募制)の援助を受けて実施された。

<u>参考文献</u>:[1] M. Higashiwaki, et al, Appl. Phys. Lett. 100 (2012) 013504. [2] Z. Hu, et al, IEEE. Elec. Devi. Lett. 39 (2018) 869. [3] 大江,第 66 回応用物理学会秋季学術講演会 (2019) 11a-S011-9.



Fig.1 Angular dependency of lateral etching rate of (010)  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O by HEATE. The rate was evaluated by undercut from the SiO<sub>2</sub> mask edge.



Fig.2 Bird view SEM image of (010)  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> surface after HEATE at 800 °C and 60 min.



Fig.3 Bird's eye-view SEM image of  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanowall arrays fabricated by HEATE. The HEATE conditions were 800°C, 100 Pa, and 100 min.